

УДК 537.226.4; 538.956

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СИЛЬНО ВОЗБУЖДЕННЫХ СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ InI

*P. Балтрамеюнас, A. Васькив, E. Геразимас,
Э. Куокштис, A. Франив*

Впервые представлены результаты экспериментальных исследований люминесценции слоистых монокристаллов InI в условиях больших скоростей генерации неравновесных носителей заряда при $T=4.2$ и 77 К. На основе анализа структуры спектров люминесценции, зависимостей полуширины линий, относительной их интенсивности, положения максимумов от плотности мощности возбуждения делается вывод о конкуренции двух каналов излучательной рекомбинации. Наблюдаемые закономерности находят объяснение в рамках модели плотного экситонного газа и конденсации электронно-дырочных пар в электронно-дырочные капли. По форме коротковолнового крыла полосы экситон-экситонного взаимодействия определена температура ансамбля экситонов. Обнаружено отклонение этой температуры от равновесной. Замечено резкое падение экситонной температуры с появлением капельной полосы в спектре излучения. Обсуждаются особенности существования электронно-дырочных капель и несконденсировавшихся неравновесных носителей заряда в кристаллах InI.

При больших скоростях генерации неравновесных носителей заряда (ННЗ) в полупроводниках возникают коллективные эффекты, большинство из которых достаточно подробно изучены в объемных (трехмерных) кристаллах [1]. Качественно другие явления могут иметь место в сильно анизотропных двумерных системах, интерес к которым в последнее время возрос в связи с появлением новых планарных структур, крайне перспективных для микро- и оптоэлектроники, а также с получением достаточно совершенных слоистых полупроводниковых соединений [2]. Интерес к этим объектам стимулируется теоретическими исследованиями [3, 4], предсказывающими уникальные особенности «двумерных» квазичастиц. Экспериментальное исследование таких слоистых кристаллов как GaSe, PbI₂, InSe и др. [5, 6], хотя и свидетельствует об определенном своеобразии экситонов и энергетического спектра в целом, однако полной ясности о двумерном характере вследствие структурных особенностей этих полупроводников нет. В этом плане актуальными представляются поиск и исследование новых слоистых полупроводников.

В настоящей работе впервые приведены экспериментальные результаты по люминесценции недавно синтезированного представителя слоистых соединений (InI) в условиях больших скоростей однофотонной генерации ННЗ. Отметим, что к настоящему времени об оптических и люминесцентных свойствах InI, так же как и аналогичных соединений всей группы A³B⁷, известно крайне мало [7-9].

Кристаллы InI обладают орторомбической решеткой с пространственной группой симметрии D_{2h}¹⁷. Направления базисных векторов a и c в плоскости слоя неэквивалентны, а оптическая ось b направлена перпендикулярно плоскости слоя. Изучался свежий скол монокристалла вдоль плоскости, содержащей векторы a и c . Использовалось однофотонное возбуждение люминесценции (для InI $E_g \approx 2$ эВ [7-9]) излучением второй гармоники лазера на основе АИГ: Nd³⁺ ($h\nu = 2.33$ эВ, $\tau_e = 10$ нс). Сигнал

люминесценции анализировался в поляризации электрического вектора световой волны $E \parallel c$ и $E \parallel a$ и регистрировался фотоэлектрическим способом на базе комплекса КСВУ-2 с использованием синхронного детектирования и численного накопления. Измерения проведены при температурах 4.2 и 77 К. Исследование поляризованной люминесценции кристаллов InI показало, что спектры в поляризации $E \parallel c$, для которой оптические переходы дипольно разрешены, а следовательно, и более интенсивны [7, 8], и спектры «слабой» поляризации ($E \parallel a$) при уровнях возбуждения, использованных в эксперименте, имеют схожий характер, поэтому в дальнейшем закономерности люминесценции кристаллов InI будут анализироваться на основе данных для поляризации $E \parallel c$.

На рис. 1 показаны спектры люминесценции монокристаллов InI в зависимости от плотности мощности возбуждения при температурах 77

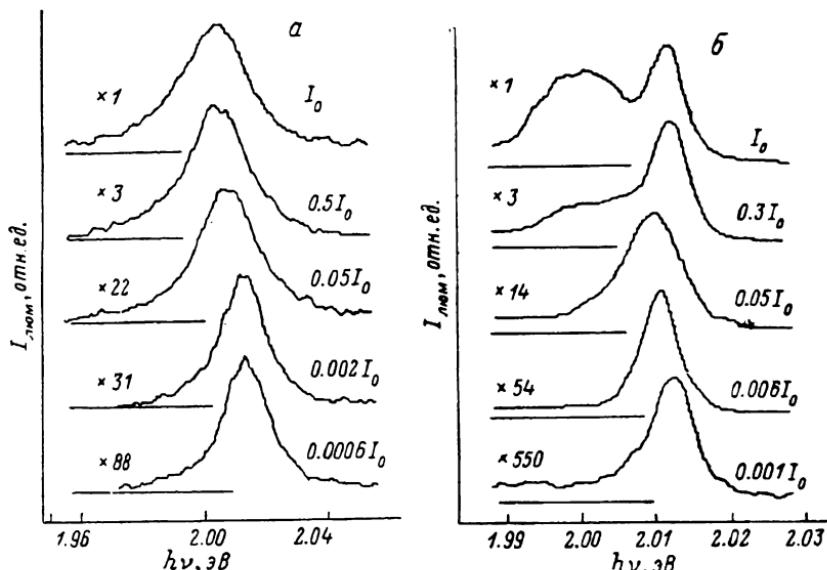


Рис. 1. Спектры люминесценции монокристаллов InI при 77 (а) и 4.2 К (б) в зависимости от плотности мощности возбуждения. $I_0 = 2.5 \text{ МВт/см}^2$.

и 4.2 К. Как видно, во всем интервале возбуждений при 77 К спектр состоит из одной полосы, максимум которой расположен около 2.014 эВ при плотности мощности возбуждения $I_b \leq 5 \text{ кВт/см}^2$. С повышением накачки максимум линии сдвигается в длинноволновую область, одновременно наблюдается уширение спектра. На рис. 2, а, б показаны зависимости полуширины ΔE и положения максимума этой полосы $h\nu_m$ от интенсивности возбуждения. Обращает на себя внимание немонотонность зависимости ΔE в области определенного интервала интенсивностей возбуждения (см. стрелку на рис. 2, а), причем примерно при этом же возбуждении зависимость $h\nu_m$ также имеет более крутой характер (рис. 2, б). Данные особенности излучения свидетельствуют о конкуренции по крайней мере двух каналов излучательной рекомбинации.

Люминесценция кристаллов InI при 4.2 К обладает несколько другими закономерностями. Так, до плотности мощности возбуждения $I_b \leq 0.2 \text{ МВт/см}^2$ в спектре наблюдается одна линия, энергетическое положение максимума которой $h\nu_m^k = 2.013 \text{ эВ}$ (при $I_b \leq 3 \text{ кВт/см}^2$). С повышением накачки она уширяется и сдвигается в длинноволновую сторону, однако в дальнейшем в отличие от $T=77$ К, начиная с плотности мощности возбуждения $I_b = 0.2 \text{ МВт/см}^2$ в длинноволновой области спектра формируется новая широкая полоса с максимумом $h\nu_m^k = 2.00 \text{ эВ}$. Характерно, что при этом коротковолновая линия претерпевает резкое уменьшение полуширины ΔE^k и «фиолетовый» сдвиг максимума $h\nu_m^k$. Это отчетливо видно из зависимостей ΔE^k и $h\nu_m^k$, представленных на рис. 2, в, г, где

стрелки обозначают интенсивность возбуждения, при которой в спектре появляется длинноволновая полоса. С дальнейшим повышением накачки вплоть до разрушения поверхности кристалла (~ 6 МВт/см²) коротковолновая линия остается почти стабильной (рис. 2, *в*, *г*), при этом возрастает лишь относительная интенсивность длинноволновой полосы. Таким образом, при гелиевой температуре конкуренция двух каналов излучательной рекомбинации становится очевидной.

Полученные экспериментальные закономерности могут найти объяснение в рамках модели сосуществования экситонного газа и сконденсировавшихся электронно-дырочных капель (ЭДК). Действительно, при 4.2 К коротковолновая линия (рис. 1, *б*) может быть обусловлена излучательной

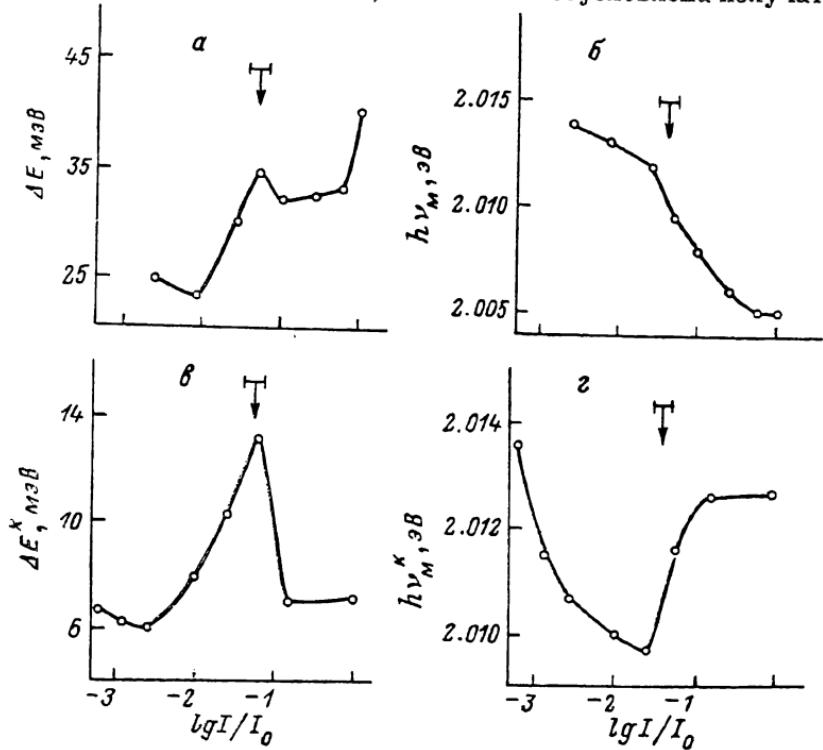


Рис. 2. Зависимость полуширины спектра ΔE (*а*), максимума интенсивности излучения $h\nu_M$ (*б*) при $T=77$ К, полуширины коротковолновой линии ΔE^k (*в*) и ее максимума $h\nu_M^k$ (*г*) при 4.2 К от плотности мощности возбуждений. $I_0=2.5$ МВт/см².

рекомбинацией при экситон-экситонном взаимодействии, причем ее длинноволновый сдвиг и уширение, наблюдаемые с ростом интенсивности возбуждения (а тем самым с увеличением концентрации квазичастиц), по-видимому, обусловлены конкуренцией упругих и неупругих экситонных соударений [10, 11], а также саморазогревом ансамбля экситонов [12, 13]. Энергетическое положение максимума этой линии на 4–8 мэВ смещено в сторону длинных волн от основного экситонного резонанса (для InI $E_{n=1}=2.017$ эВ, энергия связи экситона $E_s=4.5$ мэВ [7]). Это не противоречит модели экситон-экситонного взаимодействия, весьма подробно исследованной в объемных кристаллах [1, 10, 11]. В чисто двухмерном случае данные, так же как и другие проблемы многочастичных эффектов, изучены гораздо меньше, хотя имеются предпосылки об аналогичном характере экситон-экситонного взаимодействия и в этом предельном случае [5, 14].

ЭДК начинают формироваться при определенной пороговой концентрации ННЗ (рис. 2, *в*, *г*), что отмечалось в других полупроводниках [6, 15]. При этом в спектре краевой люминесценции кристаллов InI появляется новая длинноволновая полоса, которая, видимо, и обусловлена излучательной рекомбинацией в ЭДК. Коротковолновая же линия отвечает излу-

чательным процессам за пределами капель. Очевидно, что при наличии ЭДК в межкапельном пространстве плотность экситонов ввиду «стягивания» каплями значительного количества электронно-дырочных пар меньше по сравнению с режимом возбуждения на пороге формирования ЭДК. На это указывает резкое уменьшение полуширины и коротковолновый скачок линии экситон-экситонного взаимодействия (рис. 2, в, г).

Именно о таком характере изменения плотности экситонов, ответственных за коротковолновую линию, с повышением интенсивности возбуждения свидетельствует изменение температуры ансамбля экситонов T_s . Этот параметр целесообразно вводить для максвеллизированных экситонов (время термализации ННЗ в полупроводниках обычно значительно меньше времени жизни неравновесных квазичастиц [12]), причем T_s повышается с ростом концентрации взаимодействующих экситонов ввиду саморазогрева [13]. T_s можно определить по наклону коротковолнового края линии межэкситонного взаимодействия. Согласно [10, 14], как в трехмерном, так и в двумерном случае в области частот $h\nu > (E_{n=1} - E_0)$ интенсивность излучения при экситон-экситонном взаимодействии $I \sim h\nu/kT_s$.

Определенная таким образом температура как функция интенсивности возбуждения показана на рис. 3. Как видно, с появлением полосы ЭДК T_s резко уменьшается, что, видимо, отвечает снижению плотности экситонов за пределами ЭДК.

Как отмечалось, при 77 К поведение полуширины спектра и положе-

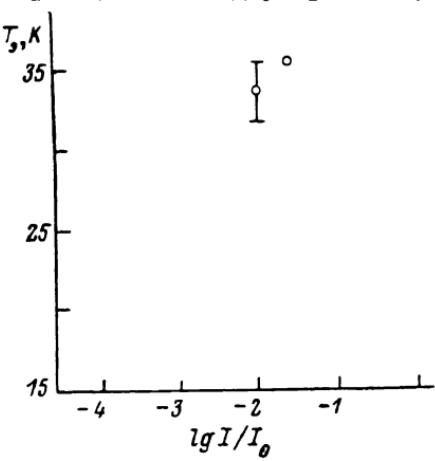


Рис. 3. Зависимость температуры системы экситонов T_s от интенсивности возбуждения при 4.2 К. $I_0 = 5$ МВт/см².

ния максимума интенсивности люминесценции с повышением накачки также указывает на конкуренцию по меньшей мере двух механизмов излучательной рекомбинации, однако интерпретация здесь более сложная из-за перекрытия полос. Возможно, ЭДК в кристаллах InI формируются и в этом случае (о высокотемпературной электронно-дырочной жидкости сообщалось в ряде других слоистых кристаллов [6]), однако эта фаза ННЗ проявляется не так четко, как при низкой температуре. Кроме того, при $T=77$ К в кристаллах InI конденсация в ЭДК, по-видимому, может осуществляться лишь из газовой фазы, представляющей собой невырожденную электронно-дырочную плазму, поскольку экситоны в этих условиях маловероятны [4], а также имеет место значительная их термическая диссоциация. Фазовая диаграмма системы ННЗ «газ—жидкость» в координатах $T-n$ при высокой температуре вблизи критической точки более «узкая», т. е. интервал концентраций, для которых возможно сосуществование газовой и жидкостной фаз, значительно меньше. Отсутствие «стабилизации» полуширины полосы излучения при 77 К и крайних накачках (рис. 2, а), по-видимому, и обусловлено переходом границы сосуществования двух фаз в область сплошной электронно-дырочной плазмы.

В заключение отметим, что полученные результаты указывают на перспективность исследования коллективных явлений в слоистых кристаллах InI ввиду хорошего спектрального разделения полос излучения разных механизмов, имеющих место в плотном газе ННЗ при низкой температуре, что может быть обусловлено сильной анизотропией электронного спектра кристалла в силу двумерного его характера, а также строением энергетических зон (например, многодолинностью), однако для более точного построения моделей в дальнейшем необходимо изучение основ-

ных параметров этих кристаллов, в частности, расчет и экспериментальная проверка зонной структуры в области края собственного поглощения, значений эффективных масс и т. п.

Л и т е р а т у р а

- [1] Klingshirn C., Haus H. Phys. Rep., 1981, vol. 70, N 70, p. 315—398.
- [2] Добровольский В. Н., Литовченко В. Г. Перенос электронов и дырок у поверхности полупроводников. Киев: Наукова думка, 1985. 192 с.
- [3] Shinoda M., Sugano S. J. Phys. Soc. Japan, 1966, vol. 21, N 10, p. 1936—1946.
- [4] Андрюшин Е. А., Келдыш Л. В., Силин А. П. ЖЭТФ, 1977, т. 73, № 3, с. 1163—1173.
- [5] Бродин М. С., Блонский И. В. Экситонные процессы в слоистых кристаллах. Киев: Наукова думка, 1986. 255 с.
- [6] Беленький Г. Л., Годжаев М. О., Салаев Э. Ю., Алиев Е. Т. ЖЭТФ, 1986, т. 91, № 5, с. 1886—1896.
- [7] Блонский И. В., Крочук А. С., Стецишин Т. Л., Франис А. В. ФТТ, 1986, т. 28, № 10, с. 3136—3139.
- [8] Ohno N., Yoshida M., Nakamura K., Nakai Y. Sol. St. Commun., 1980, vol. 35, p. 775—779.
- [9] Ohno N., Fujita M., Nakai Y., Nakamura K. Sol. St. Commun., 1978, vol. 28, p. 137—139.
- [10] Moriya T., Kushida T. J. Phys. Soc. Japan, 1976, vol. 40, N 9, p. 1668—1675.
- [11] Baltramiejunas R., Kuokštis E. Phys. St. Sol. (b), 1982, vol. III, p. 187—193.
- [12] Shah J. Phys. Rev. B, 1977, vol. 9, N 2, p. 562—567.
- [13] Baltramiejunas R., Kuokštis E., Žukauskas A. Phys. St. Sol. (b), 1983, vol. 119, p. 453—457.
- [14] Валкунас Л., Скайстис Э. ФТТ, 1976, т. 18, № 9, с. 2594—2598.
- [15] Райс Т., Хенсел Дж., Филлипс Т., Томас Г. Электронно-дырочная жидкость в полупроводниках. М.: Мир, 1980. 350 с.

Вильнюсский государственный университет
им. В. Каспукаса
Вильнюс

Поступило в Редакцию
3 августа 1987 г.